Applikationsschwerpunkt	Zielstellung	Bemerkung
High-Speed-Flash-In-System-Programmierung	Programmierung von serielltem Flash (SPI, I ² C), FPGA-Boot-Flash, parallelem Flash (NOR, NAND)	Bis zu 100-mal schneller als zum Beispiel Boundary Scan
RAM-Test	Test der Verbindungen zwischen FPGA und RAM (sRAM, dRAM. . .)	Höhere Testgeschwindigkeit als Boundary Scan, aber gleiche Pin-Level-Diagnose
Frequenzmessung	Überprüfung von Clock-Signalen (Single-ended, differenzial)	Instrument ist auch zur Toggle-Erkennung einsetzbar
LAN-Test	Test der Verbindungen zwischen FPGA und externem MAC/PHY	Protokoll-basierter Funktionstest
Bit Error Rate Test (BERT)	Test von Gigabit-Verbindungen, inklusive Augendiagramm-Visualisierung	Unterstützung paralleler Übertragungskanäle wie z.B. PCIe x16

Tabelle 2. Beispiele von ChipVORX-Applikationen.

Tabelle 1. Charakterisierung diverser Implementierungsstrategien für FPGA-embedded Instruments.